

公益社団法人日本顕微鏡学会 第 82 回学術講演会

優秀口頭発表賞

テnder-X 線スペクトロタイコグラフィ
計測システムの開発とミクロン厚高分子の
3 次元硫黄化学状態イメージング

Development of Tender-Xray Spectroscopic
Ptychography Measurement System and
Three-dimensional Sulfur Chemical State
Imaging of Micrometer-thick Polymers

佐々木 雄平

東北大学

2026 年 5 月 25～27 日

第 82 回学術講演会

実行委員長 津田 健治

